

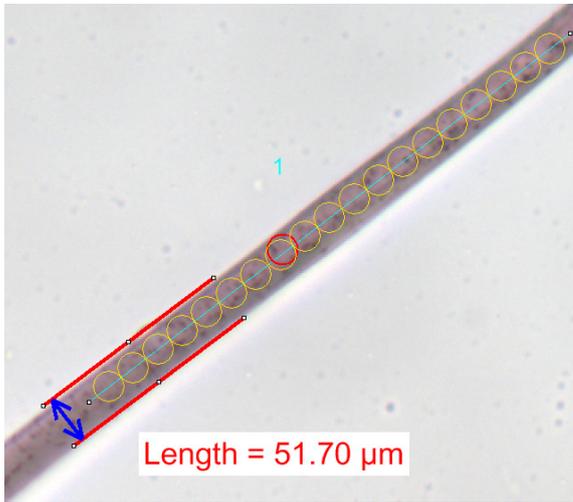
## SYSTEM FÜR MIKROSPEKTROMETRIE



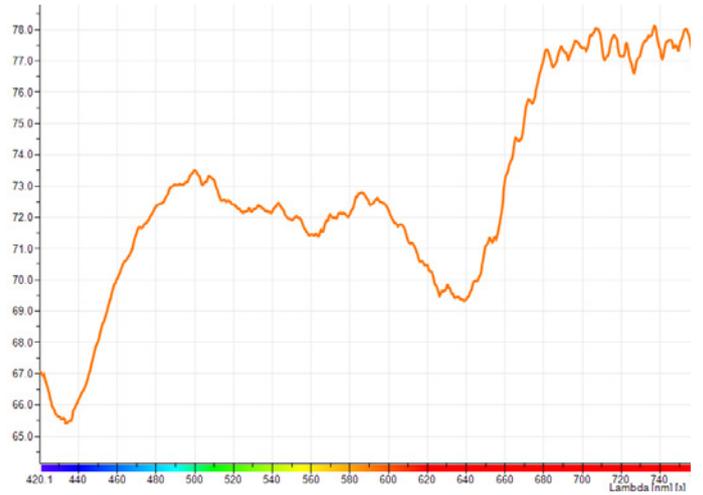
Die Kombination eines voll ausgestatteten Nikon-Mikroskops mit einem hochpräzisen motorisierten Tisch und einem Qualitätsspektrometer garantiert eine universelle Mikrospektrometrie-Lösung zur Analyse verschiedener forensischer Spuren wie Fasern, Lackspänen oder Tinten. Das Kamerabild (ca. 3,2 x 2,0 mm für 5x Objektiv) und das Spektrum eines definierten Bereichs innerhalb des Kamerabildes (Kreis mit einem typischen Durchmesser von 40 µm für 5x Objektiv) werden gleichzeitig betrachtet. Die Größe der Spektrometer-Sonde kann auf die angeforderte laterale Auflösung abgestimmt werden, indem ein geeignetes Pinhole in der Spektrometerhalterung ausgewählt wird. Ein einfacher Klick innerhalb des Kamerabildes verschiebt den Probenpunkt direkt in die Spektrometeransicht mit 1 µm Genauigkeit. Eine beliebige Anzahl von Punkten innerhalb der gesamten Probe kann dann markiert, automatisch gescannt und gemittelt werden, um das endgültige Spektrum zu erhalten. Transmissions- / Reflektions-, Absorptions- und Kolorimetrie-Modi stehen zur Verfügung. Ermittelte Spektren können in der Datenbank zur Archivierung gespeichert, in MS Excel exportiert oder in einen einfachen PDF-Report umgewandelt werden.

## HIGHLIGHTS

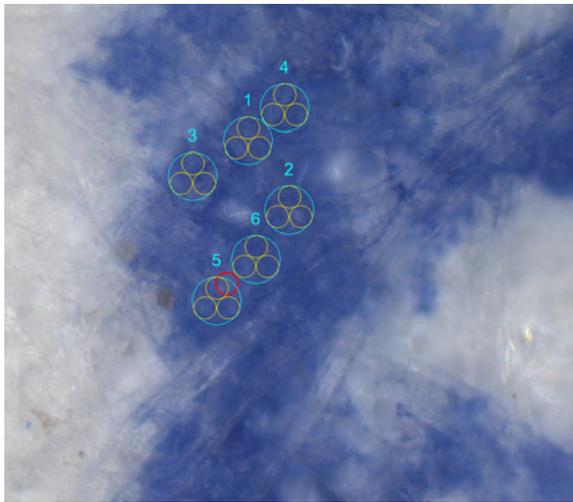
- Vielseitiges Spektrometer für nahes UV, VIS, nahe IR - Spektroskopie
- 2.3 Millionen Pixel Farb-CMOS-Kamera ermöglicht ein gleichzeitiges Live-Kamerabild
- Hohe Präzision und Wiederholbarkeit (1 µm) XY-Tisch mit langem Verfahrensweg (bis zu 100 mm)
- Präzisionstischsteuerung (Joystick oder Einzelklick in der Software)
- Modulares, vielseitiges Nikon-Mikroskop für Hellfeld-/Dunkelfeld-Mikrospektroskopie mit Auflicht- und Durchlicht-Beleuchtung, polarisierte Lichtmikroskopie mit einem Satz von Objektiven (5x - 40x) und Fluoreszenzmikroskopie (optional)
- All-in-One Software-Integration - Live-Spektrum, Live-Kamerabild, Tischsteuerung, Definition von Scan-Punkten, automatisches Scannen, Spektrumanalyse und Berichterstellung



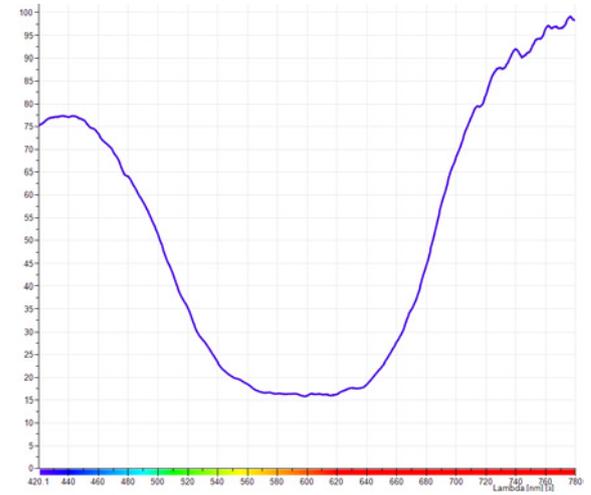
Faser



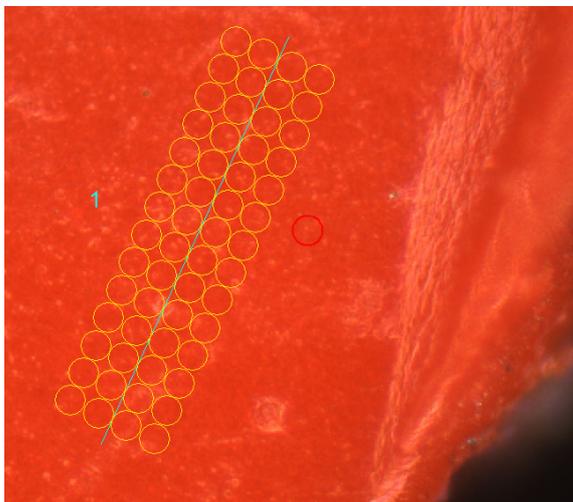
Durchlässigkeit gemessen im Helfeld, Durchlicht-Beleuchtung



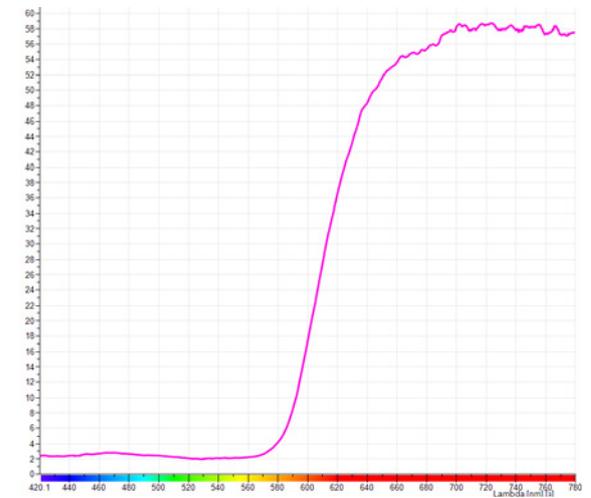
Stempeltinte



Reflexion im Dunkelfeld gemessen, Auflicht-Beleuchtung



Lack-Chip



Gemessen in Dunkelfeld, Auflicht-Beleuchtung